

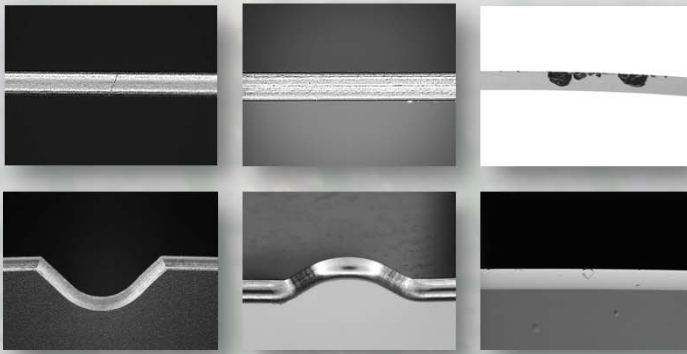
ウェハエッジ検査装置

WAFER EDGE INSPECTION SYSTEM

SEL-WEISシリーズ

- ウェハの外周部分のチッピング(欠け)や異物を自動検査
- 検出する欠陥のサイズを自由に設定可能(光学方式と画像処理方式)。
- 欠陥のあるウェハを色分け表示。
欠陥の位置をマップ表示。

特許出願中



《特長》

- ・検出する欠陥のサイズを自由に設定可能。
- ・パターンがベベル部分に掛かっても検査可能。
- ・ノッチ部分、オリフラ部分の欠陥も検出。
(ノッチ部分のAPEXの観察に付いては別途ご相談ください)
- ・透明・半透明ウェハの場合、内部に混入している異物や欠陥も検出可能。
- ・ノッチ・オリフラ位置はアライナーを使用せず画像で検出。
- ・光源にLEDを使用している為、ランニングコストが殆ど掛からない。
- ・スリムでレイアウトが容易。

《チッピング検出可能ウェハ》

- ・ベアウェハ
- ・パターン付ウェハ
- ・薄ウェハ/厚ウェハ(反りがあっても問題ありません)
- ・化合物ウェハ
- ・透明・半透明ウェハ(SiC, サファイヤ, 石英...)
- ・エピウェハ
- ・その他のウェハに付いてはご相談ください。



SPEC SHEET

	WEIS-100	WEIS-150	WEIS-200	WEIS-300
	4inch	6inch	8inch	12inch
検査対象ウェハ	・原則、ウェハの種類は問いません。			
検査内容	欠陥の検出・表示			
表示方法	・欠陥を検出したウェハの番号を表示。 ・欠陥位置座標をマップで表示。 ・画像を自動保存。(異常箇所・正常箇所)			
スループット	約3.5秒/1枚		約4.5秒/1枚	別途お打合せ
照明	LED			
GUI	タッチパネル			
搬送系	カセット : 上下動エレベータ 搬送アーム : 一軸 検査ステージ : 回転ステージ			別途お打合せ
装置サイズ	W:650 X D:1000 X H:1700			別途お打合せ
ユーティリティ	AC100V VA:2K (MAX) 圧空			別途お打合せ
重量	約400kg		約450kg	別途お打合せ

※サイズ違いのウェハの検査が1台で兼用出来ます。
※ノッチのAPEX部分の検査に付いては別途ご相談ください。

オプション

異物検査	内部に異物が混入している欠陥の検出機能です。 (パターンが入ったウェハは異物検査は不可です)
上位通信	工場側の上位PCとの通信機能 (SECS, GEM300など)
その他	2カセット仕様、FFU、イオナイザー

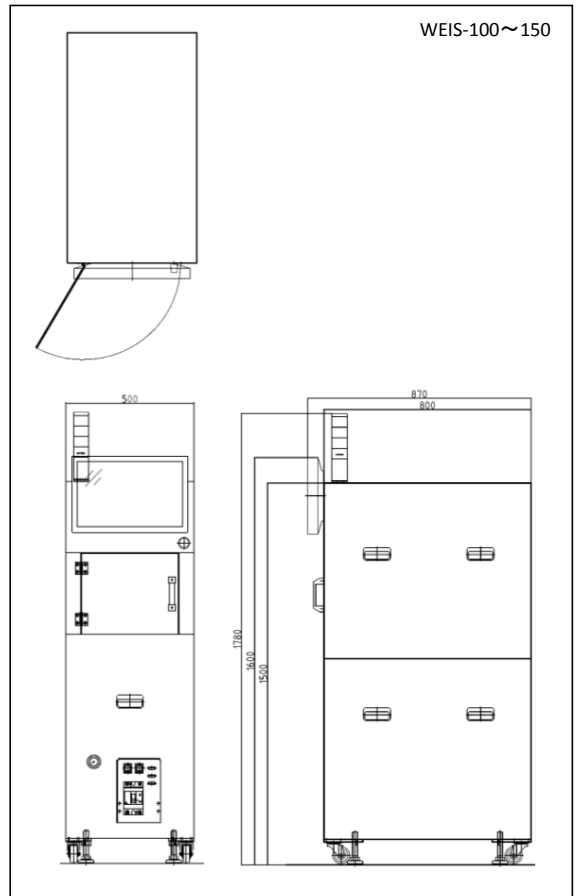
検査画面



結果表示画面



WEIS-100~150



<http://www.showalabo.co.jp>

✉ info@showalabo.co.jp

〒819-0015 福岡市西区愛宕1丁目14-35

PHONE : 092-881-0238 FAX : 092-881-0217